Accounts of Materials & Surface Research

Molecular Scale View of Electric Double Layer at Electrolyte / Electrode Interfaces

Ken-ichi FUKUI*

Department of Materials Engineering Science, Graduate School of Engineering Science, Osaka University 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan kfukui@chem.es.osaka-u.ac.jp

Recent development of frequency modulation (FM-) AFM operated in liquid environment enables one to analyze "interfacial liquid structure" in addition to high resolution imaging of the interfacial solid. Using electrochemical (EC-) FM-AFM which we developed in 2010, we have

succeeded in analyzing electric double layer (EDL) structures whose local structure varied depending on the applied electrode potential. In this account, I would like to focus on the analyses of the EDL at electrolyte aqueous solution / graphite interfaces. It was revealed that a hydrogen-bonding network at the interface greatly perturbed by accumulated anions at anodic potentials (enhanced or disturbed). Besides, such a change in the EDL structure changes the assembly and the redox activity of the adsorbed molecules. Molecular dynamic (MD) simulations of the EDL structure are presented to achieve the molecular scale understanding of such interfacial phenomena.



Keyword: electric double layer, hydration, interfacial energy, electrochemical device

Ken-ichi Fukui received his Doctor of Science from the University of Tokyo in 1994. Prior to his present position as a Full Professor at Osaka University since 2008, he started his career as an Assistant Professor at the University of Tokyo in 1994 and had been an Associate Professor at Tokyo Institute of Technology since 2002. His current research interests cover the microscopic mechanism of catalyses at solid surfaces/interfaces, the molecular view of electric double layer at liquid/solid interfaces for efficient energy conversion, and development of novel methods for interfacial chemical states analyses at sub-nanometer resolution (Researcher ID:



E-1455-2011). Representative awards he received are Fellow of the Surface Science Society of Japan (2012), Selected researcher of the Funding Program for Next Generation World-Leading Researchers of JSPS (2012), Nanoprobe Technology Award from the JSPS (2015), and the CSJ Award for Creative Work from the Chemistry Society of Japan (2017).

電気二重層の分子スケールでの実像に迫る

福井 賢一 *大阪大学大学院基礎工学研究科*

1. はじめに

表面に電荷をもった(帯電した)物質を電荷 質溶液の中に入れるとその電荷を打ち消すよ うなイオンが近くに分布しやすくなり,正の電 荷の層と負の電荷の層が相対した電気二重 層が生じる。電気二重層の厚みは溶媒中の 電解質濃度に依存し、10⁻³ M の濃度の一価 のイオンの水溶液で形成される電気二重層は 10 nm であるが, 0.1 M になると溶液中の)1 nm まで薄くなる(厚みは Debye 長に相当する (Figure 1a))¹⁾。よって, そこには大きな電場が 集中し,二次電池,燃料電池,色素増感太陽 電池など電極での電子移動を伴う反応の driving force を生み出している。表面電荷ゼロ Potential of zero charge (PZC))の電位を境に して, 電極電位を正(負)にすれば電極表面 は正(負)に帯電して Stern 層としてアニオン (カチオン)が電極に吸着するとともに、その外 側の拡散層にはアニオン(カチオン)が過剰 に存在しながらバルク溶液の組成へと連続的 につながる¹⁾。電位を変えても電気二重層の 厚みは変わらない。

一方で,液中での電子移動反応の速度を 定式化した Marcus(1992 年ノーベル化学賞受 賞)の理論からは,電子移動の効率は電極電 位で決まる平均的な電気二重層構造に加え て局所的な溶媒の配向やイオンの分布によっ て大きく作用されることがわかる¹⁾。つまり,例 えば二次電池のエネルギーキャリアである金 属イオンの電子移動も,単に電極との距離や そのイオンに対する溶媒和の強さだけでなく, 局所環境で決定されるエネルギー状態によっ て効率が変化するはずである。ところが,電気 二重層の有効な局所解析手法はこれまでほと んどなかったのが実情である。

ごく最近,周波数変調 AFM (FM-AFM)は, 変位検出系の低雑音化という技術革新によっ

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.5), 110-117.

て共振振幅を溶媒分子サイズ以下で制御す



Figure 1. (a) Schematic of potential diagram of an electric double layer of an aqueous solution, (b) schematic of EC-FM-AFM, and (c) illustration showing the detection of layered structuring of interfacial liquid by force curve measurement using FM-AFM.

ることが可能となり,カンチレバーの共振Q値 が大きく低下する液体中においても高感度な 力検出が可能となった。これにより,固液界面 の固体側構造の原子分解能の画像化だけで なく『界面近傍の液体の局所情報』が得られる ようになってきた²⁾。我々は,この顕微手法を 電気化学系に適用可能な電気化学 FM-AFM(EC-FM-AFM)を2010年に世界に 先駆けて開発し^{3,4)},これを用いて,界面での 酸化・還元過程に伴う電荷分布の変化に応じ た局所構造を報告してきた。

本稿では、グラファイト電極と界面を形成す る電解質溶液に生じる電気二重層を例として、 EC-FM-AFM を用いた分子スケールでの解 析例を紹介したい。グラファイト電極の電位に 応じて接近する電解質イオンの水和エネルギ ーの違いにより、界面での水和ネットワーク構



Figure 2. (a) Hydrogen-bonding water molecules in bulk solution, and (b) two stable alignments of H_2O at an aqueous solution / HOPG interface at neutral (at pzc) or slightly positive-charged state. These alignments can minimize the loss of hydrogen bonding for interfacial H_2O at the hydrophobic HOPG surface. 造が顕著な変調を受けること,さらに界面エネ ルギーの変化によって,界面吸着分子の集合 状態や酸化還元反応活性にも影響を与えるこ とが分かってきたのである。

2. グラファイト電極と接する電解質水溶液の イオン種と電位に依存した構造化

電極基板と垂直な方向に探針を動かして力 を計測する force スペクトル測定により,界面 近傍の水のネットワーク構造の強さが評価で きる 4-6)。一般に固体と接する水は界面に沿う ように層が形成される。界面に於いても水分 子は非常に速く動き回っているため,層といっ ても水分子がその位置に固定されている訳で はなく、周囲の分子と置き換わりながらも分子 の確率密度が高い位置が結果的に固体に沿 った層状になると考えれば良い。Figure 1cの ように, 溶液中で固体表面に向かって(水分子 のサイズと同程度の振幅で)共振させた探針を 動かし, 探針先端がこの水の層にぶつかると 斥力が増加(共振周波数が増加)し、ある力に 達すると層を壊して探針が侵入するため力が 減少(共振周波数が減少)する。よって、力のピ ークの間の間隔は"層間距離"に相当し、ピー クの強度は"層の堅さ"に対応する。

では,固体との界面における液体の構造化 とはなんだろうか。液体一般について考えると、 固体に沿って剛体球が並ぶように分子サイズ の縁取りをする,さらにその上に球がならぶと いうように、どちらの方向にも移動できるバルク 状態と比べて,運動が制限されることによる効 果と考えられる。一方,水分子の場合には,水 素結合の効果が顕著となる。バルクの水の中 では水分子は、自由に運動しながらも、Figure 2(a)のように平均4つの分子と水素結合を形成 する。固体との界面で水分子がどう配向する のかは、その固体の親疎水性と強く関係する が,本稿で取り上げる疎水性のグラファイト基 板と界面を形成して分子動力学(MD)計算を 行うと, Figure 2b の2つの配向を取りやすいこ とが分かる。表面に平行な左の配向は中性グ ラファイトとの界面では最も安定で,水分子の ダイポールがつくる電場が固体内部に侵入し



Figure 3. (a, e) Cyclic voltammetry and (b, f) potential dependent structuring of interfacial water faced to positively charged HOPG surfaces evaluated by force curves obtained using EC-FM-AFM: (A) 0.1 M $HCIO_4$ aq, (B) 0.1 M H_2SO4 aq. (c, g) Force of the primary hydration peak by conversion of the force curves. Electrode potentials refer to RHE. (d, h) Models of different structuring for each solution.

ないので有利である。一方,一つの水素が上

を向いた右の配向は、ダイポールの向きは最 適とは言えないが、周囲の分子との水素結合 の構築が比較的たやすい。後に述べるように、 電極電位を変化させるとこの水の配向の安定 性も変わることとなる。

では実際に、グラファイト電極と接する電解 質水溶液において, 界面の水分子が構造か する様子を見てみよう。Figure 3b に示すように, 0.1 M HClO4 水溶液の中で, グラファイト電極 に沿った水の層に対応する振動力が観察さ れていることがわかる 5。特に図中に両矢印で 示すグラファイトに面した水の"層の堅さ"に対 応するピーク強度に注目すると,より正の電位 で小さくなっていることが分かる。この水溶液 中で,電極上に電荷が生じなくなる(電極が電 気的中性になる)電位である PZC はおよそ可 逆水素電極(RHE)を基準として約0Vであった ので,グラファイト電極がより正に帯電するほ ど"層の堅さ"が堅くなっている(Figure 3c)。な お,元の電位に戻すと Figure 3b の青色のカ ーブのように同じピーク強度に戻ることから、こ の変化は可逆な過程である。

一方,同様の実験を0.1 M H₂SO₄水溶液中 で行った場合には,電位に対する水の"層の 堅さ"の変化は全く逆になり,より正の電位で 堅くなる(Figure 3f, 3g)⁵⁰。つまり,グラファイト に面する水の"層の堅さ",すなわち水の水素 結合ネットワークの強さは,電解質イオンの種 類と電位に依って顕著に変化するのである。

HClO₄を水に溶解すると水分子のエントロピーは 38 J mol⁻¹ K⁻¹ 増加し,一方,H₂SO₄を溶 解したときには 44 J mol⁻¹ K⁻¹減少する⁷⁾。この ことから,ClO₄-アニオンは水素結合を壊して 水分子のエントロピーを増大させ,0.1 M H₂SO₄溶液での主なアニオンである HSO₄-は 水素結合を助けてエントロピーを減少させるイ オンに分類される。Figure 1a に示したように, 正電荷を帯びた電極との界面では反対符号 の電荷をもつアニオンの濃度が高くなり,これ らアニオンの相対する性質から,界面水和層 の水素結合ネットワークをそれぞれ弱めたり (Figure 3d),強めたり(Figure 3h)すると考える ことができる⁵⁾。 この考え方を検証するために,我々は最近, 0.1 M HCl 水溶液中でも同様の実験を行った。 Cl-イオンはやや疎水的なイオンに分類され, ClO₄-と HSO₄-の中間的な性質を示す。する と予想通り,グラファイトが正電荷を帯びる電 位において,面する水の層は堅くなることが確 認された。

グラファイト上にはこれらいずれのアニオン も特異吸着(吸着サイトの定まった直接的な吸 着)は起こらないので、アニオンの種類が違う だけで基板に面した水の水素結合ネットワー ク構造まで大きく変化するというのはこれまで 想定されていなかったことである。

電解質イオンが実際に界面の水和構造にど のように影響を与えるかを分子スケールで探 るため, 我々は MD 計算による評価を進めて いる。約9 nm の厚みの 0.5 M 電解質水溶液 を2枚のグラファイトで挟んだ系を構築し,相 対するグラファイトの表面炭素原子にそれぞ れ正または負の均一の電荷を割り当てて,定 常状態になってから10 ns 程度計算することで、 正電荷および負電荷を帯びた各電位におけ る水分子や電解質イオンの配向,密度,運動 性を評価することができる。Figure 4 はその一 部を示したものである。サイズが小さく親水性 の F⁻アニオンはグラファイトに接する第一水 和層へ侵襲がほとんど起こらないが, サイズが 大きく疎水性の Гアニオンはかなり侵襲が見 られる。グラファイト電極が正に帯電した Figure 4a の状態では, Figure 2b に示された 水分子の2つの安定な配向のうち一つの水素 を上に向けた右の配向の割合が増える。F⁻ア ニオンの場合には、この配向の水分子を間に 挟んでグラファイト電極と面するのがエネルギ ー的に安定であり、グラファイト表面に近寄れ ないのである。実験で用いた ClO₄-アニオン は I-よりさらに第一水和層へ取り込まれ易く (Figure 4b), グラファイトが電荷をもたない PZC 電位でもかなり界面偏析が見られる。こ れは特異吸着ではなく, 疎水性のグラファイト 表面との間の疎水性相互作用に分類されるも のと考えることができる。グラファイトが正に帯 電した anodic 条件ではさらに界面の ClO₄-ア



Figure 4. (a) Density distribution of water and halogen anions at positively charged graphite surface in 0.5 M solution. (b) Anion dependent distribution and (c) anion density at the first hydration layer faced to graphite.

ニオンが増加し,定性的には Figure 3d の想 定を支持するものである。実験と対応する水 素結合ネットワークの強さは現在解析を進め ている。

同様の界面水分子の構造化の可逆的な電 位変化は、ClO₄-アニオンの特異吸着が起こ らない疎水性のヨウ素修飾 Au(111)との界面 でも見られた⁹。さらにこのケースでは、電極 電位による界面水和構造の変化は、 EC-FM-AFM による表面のイメージングの可 否にも関係する。Figure 5a に示すように、負 電位側では Au(111)上に配列した I 原子が解 像されるが、Figure 5b 上部のように水和構造 に乱れが生じる正電位側では原子像は見ら れず、負電位側に戻すとすぐに再び解像でき るようになる。また、対応する電位の force スペ クトル(Figure 5c)をみると、I 原子が解像できる



Figure 5. (a, b) Potential dependent EC-FM-AFM imaging of an I modified Au(111) surface in 0.1 M HCIO₄ aq. (c) Force curves at corresponding potentials and schematic models of the interface structures. Electrode potentials refer to RHE.

電位では第1水和層が明瞭なピークとして観 測されるが、観察できない電位では乱れにより ピークとしては判別できない。この違いは、 Figure 3a と同様の第一水和水の水素結合ネ ットワークの弱体化とともに、吸着 I 原子の可 逆的構造変位が伴っている。

以上で紹介した EC-FM-AFM 計測では, 界面での水素結合ネットワークの評価ができると述べたが, その時間スケールについては注意が必要である。バルクの水の中での水分子の自己拡散係数は D(300 K)~10⁻⁵ cm⁻² s⁻¹であり, その値は動きが制限されるグラファイトとの界面においても桁までは変わらないから, 電

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.5), 110-117.

極に面した第1層水和層に水がとどまる時定 数は300 Kで20 ps 程度である。一方,実験に 用いているカンチレバーの共振周波数は水 溶液中で約140 kHz であるから,探針先端が 最近接点に達してから次に達するまでの時間 は約7 µs である。よって,測定されている水 素結合ネットワークの強さはあくまでも時間平 均値であり,水分子も溶質イオンもその間には 大いに入れ替わっているのである。

3. グラファイト電極の界面エネルギーの変化 に伴う界面に補足された分子の集合状態や 酸化還元反応活性の変化

このような電極界面近傍にあるイオンの挙動は、電極位置での界面エネルギーを変え、 界面に補足された分子の組織化を阻害また は促進し、その結果としてそれら分子の酸化 還元反応の効率をも大きく変化させることが分 かってきた¹⁰。

中性でビラジカル性(3つのベンゼン環が縮 合した各フェナレニル(Figure 6a)に1つずつラ ジカルをもつ共鳴構造が描ける)を示しながら 酸化還元活性なフェナレニル誘導体 (TTB-IDPL)は、グラファイト電極の電位に応じ て凝集と分散が可逆的に起こる(Figure 6b)¹⁰⁾。 この分子は 0.1 M HClO₄水溶液中で 0.15 V vs. RHE にて-1 価↔0 価の酸化還元電位ピー クをもつ(Figure 6a)^{10,11)}。分子が 0 価である電 位 0.48 V で測定される AFM 像では, 分子が 完全に分散してグラファイト表面を素早く拡散 しており,速すぎて画像化できない)。一方,電 位 1.28 V で測定された AFM 像では, TTB-IDPL 分子が数分子程度の厚みで凝集 し、拡散が全く抑制されている。このような分 子の分散と凝集の変化はグラファイト電極の 電位に対して可逆に変化するが,分子凝集体 のサイズがこの数倍大きくなる場合には,電位 を 0.48 V 以下に戻しても凝集体のまま分散さ れない分子が生じる。その場合には、 グラファ イトに直接接する分子以外は酸化還元反応が 起こらないことも確かめられている 11)。つまり、 分子の凝集状態は酸化還元反応の効率に直 接影響するのである。



Figure 6. (a) CV of TTB-IDPL-adsorbed HOPG electrode (075 ML) in 0.1 M HCIO₄ aq, where TTB-IDPL molecules show a redox peak between -1e charge and 0 (neutral). (b) Series of EC-FM-AFM images $(1 \times 1 \ \mu m^2)$ showing a reversible morphological change of TTB-IDPL molecules depending on HOPG electrode potentials. Electrode potentials refer to RHE.

この凝集一分散が切り替わる電位は, Figure 3A で同様にグラファイト電極と接する 0.1 M HClO₄ 水溶液の第一水和層の水素結 合ネットワークが弱くなる電位とちょうど対応す る。界面で ClO₄⁻アニオン量が増えて水素結 合ネットワークが弱くなると,正電荷を帯びた 表面で有利な一つの水素原子を上に向けた Figure 2b 右の配向の割合が高まり,中性でダ イポールをもたない TTB-IDPL 分子がグラファ イトと接するよりも界面エネルギーを下げられ ると考えられる。結果として TTB-IDPL 分子同 士が凝集してグラファイトと接する面を少なく するように上に重なっていく。

固液界面は,しばしば固体表面の機能化 修飾のために分子を配列させる場としても利 用されるが,界面エネルギーの電位依存性は,

Acc. Mater. Surf. Res. 2017, Vol.2 (No.5), 110-117.

電極の機能化を考える上で考慮すべき重要 な因子であることが明らかとなってきた。

4. おわりに

以上のように,歴史的には電気化学 STM(EC-STM)の開発によって可能となった 電極上に特異吸着する電解質イオンの解析 に加え,EC-FM-AFM という界面近傍の液体 の局所情報を得るツールが開発されたことで, 電気化学デバイスの基礎となる電気二重層界 面の局所構造の理解が格段に進むものと期 待される。本稿では電解質水溶液に限って紹 介したが,Li イオン電池に用いられているよう な有機電解質溶液や,イオンのみで形成され ている電解質液であるイオン液体などにも,こ こで紹介した解析手法は有効である^{12,13}。

実験のみでは確定できない分子論的な描 像を得るには界面の MD 計算がかなり有効で あるが, MD 計算は古典力学に従う手法であ るため, 分子の反応や分子との電子移動課程 などは扱うことができない。今後, 界面電子移 動過程も視野に入れた第一原理分子動力学 計算へと移行して行く必要があるであろう。

5. 謝辞

本稿で紹介した成果は,最先端・次世代研 究支援プログラム(GR071)や科研費(22350008, 26620008),財団からの助成の支援を受けて 実施した。さらに,多数の先生方との共同研 究により実施されたものであり,この場を借りて 謝意を示したい。

参考文献

- A. J. Bard, L. A. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications (Wiley, Hoboken, NJ, 2001) 2nd ed.
- K. Kobayshi, H. Yamada, in Noncontact Atomic Force Microscopy, ed. S. Morita, F. J. Giessibl, E. Meyer, R. Wiesendanger (Springer, Cham, 2015) Vol. 3, p. 411-432.
- K. Umeda, K. Fukui, *Langmuir*, 2010, 26, 9104-9110.
- 4) Y. Yokota and K. Fukui, in Noncontact

Atomic Force Microscopy, ed. S. Morita, F. J. Giessibl, E. Meyer, R. Wiesendanger (Springer, Cham, 2015) Vol. 3, p. 461-477.

- T. Utsunomiya, Y. Yokota, T. Enoki, K. Fukui, *Chem. Commun.*, **2014**, *50*, 15537 -15540.
- K. Fukui, T. Utsunomiya, Y. Yokota, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **2017**, 56, 08LA03.
- 7) Y. Marcus, Ion Solvation (Wiley, Chichester, U. K., 1985).
- M. Imai, Y. Yokota, I. Tanabe, K. Inageki, Y. Morikawa, K. Fukui, in preparation for publication.
- T. Utsunomiya, S. Tatsumi, Y. Yokota, K. Fukui, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2015, 17, 12616-12622.
- T. Utsunomiya, Y. Yokota, T. Enoki, Y. Hirao, T. Kubo, K. Fukui, *Carbon*, 2014, 77, 184-190.
- 11) T. Utsunomiya, Y. Yokota, T. Enoki, Y. Hirao, T. Kubo, K. Fukui, *Carbon*, 2013, 63, 196-201.
- 12) 福井賢一, 表面, 2013, 51, 241-252.
- 13) K. Fukui, Y. Yokota and A. Imanishi, *Chem. Rec.*, **2014**, 14, 964-973.